低エネルギーホログラフィー 電子顕微鏡の開発

Development of Low Energy Holography Electron Microscope

新竹 積,安谷屋秀仁,山下 真生,

マーティン・フィリップ・チャン Tsumoru Shintake, Hidehito Adaniya, Masao Yamashita and Martin Phillip Cheung

OIST 沖縄科学技術大学院大学

- 要 旨 生体サンプルに対して高いコントラストを得るために 低エネルギーとし、さらに位相情報を得るために In-line Holographyを採用. FFT により波の伝搬を計算して物体 波の複素振幅を得ている. これにより高い位相コントラ スト像が得られる. 分解能はまだ高くないが、氷包埋し たウイルス等のナノ粒子の観察ができつつある. 現在こ の顕微鏡に適したサンプルの作製手法の開発に取り組ん でいる.
- キーワード: In-line Holography, Gabor, ホログラフィー, 低エ ネルギー, 電子線回折

1. はじめに

1948 年 Nature に掲載された Gabor の論文¹¹に端を発して, ホログラフィーはレーザーの発展と共に各方面に応用され てきた. その中で電子線ホログラフィー (Off-axis Electron Holography) は,故外村彰先生が先駆的研究を指揮され, AB 効果 (Aharonov-Bohm effect)論争に決着をつけるという 輝かしい業績をあげられた.現在,我々は OIST 大学にて Gabor が提唱した In-line Holography に基づいて生物試料向 けにホログラフィー電子顕微鏡を開発している.

さてこのホログラフィー電子顕微鏡の大きな特徴として, (1)3次元の物体を2次元の画像に記録することが可能.

(2)撮影後にもイメージの焦点を任意にコンピューター上で 変更することができる.

(3) サンプルの横方向への平行移動に対してホログラムが鈍 感なため,例えば氷包埋されたサンプルを TEM 観察する場 合に問題となる氷の変形移動や振動に対して許容度が大きい

〒 904-0495 沖縄県国頭郡恩納村谷茶 1919-1
TEL: 090-1905-8379
E-mail: shintake@oist.jp
2017 年 1 月 17 日受付, 2017 年 3 月 12 日受理

という際立った特徴がある.

(4) 点光源を作るための収束レンズの収差は容易に補正可能 であり,分解能は収差により制限されない.

(5) また実用上重要な事として、サンプルの下流には対物レンズが存在せず、サンプルの周辺に広い自由空間が確保できるため、環境ガスやナノプローブ等のツールを持ちこむことが可能となる.

(6) 生体サンプルなどの低元素の物体は位相物体となり通常 の TEM では原理的にコントラストがゼロとなってしまう. そこで通常, 意図的に焦点を1µm 程度ずらしてコントラス トを上げて撮像するということが行われているが, これによ る分解能の低下を免れない. ホログラフィーでは複素振幅が 直接得られるため, この問題がない. 位相板を用いたイメー ジングと同等またはそれ以上の可能性がある.

したがってホログラフィー電子顕微鏡が実現すれば、生体 サンプル等の3次元構造を観察する有効な手段となる.

Gabor の In-line Holography では、電子ビームを一旦収束し、 微小な点光源を形成させ、ここから 100 µm 程度下流にサン プルを置く. 散乱された物体波と点光源からの元々の参照波 とが重なり干渉し、その強度に周期的な縞模様が現れ、ホロ グラムとなる. これを CCD 等の2次元検出器により記録す る. フーリエ変換の手法により、サンプル位置での複素振幅 を再生することにより、サンプルの像を得ることができる.

我々は、さらに高いコントラスト(複素振幅)を得るため に低エネルギーの電子ビームを用いたホログラフィー顕微鏡 を開発した.電子の最高エネルギーは30kV,最低エネルギー は100Vである.氷包埋の生体サンプルは、通常20~30kV にて観察している.現在、細菌の鞭毛や分泌装置の観察を準 備中である.これらのサンプルは、病理学的に大変重要であ り、構造解析をめぐる研究が世界中で盛んに行われている.

2. 基本構成

図1に我々が開発したホログラフィー電子顕微鏡を示す. 左にコヒーレントな電子源としてカールツァイス社の Geminiカラムを搭載. SEM 機能によりサンプルの表面観察 も可能. Geminiの電子源はショットキー型電子銃 (Schottky FE: Schottky Field Emission Gun, 電気化学工業 DENKA TFE174C SE)である(図2). タングステン表面に ZrOのコー ティングが施してあり, 仕事関数をタングステン単体の 4.2 eVから2.7 eVに下げている. さらにショットキー効果(電 界による障壁の低下)によって実効的な仕事関数を下げて 1800 K のカソードから効率的に熱電子を引き出している. 図2は分解能が低下したため交換したカソードであり, 左 右に微細な有機物が炭化したと想定される付着物が発見され た. 交換後すぐに通常運転に戻った. なおショットキー型電 子銃はフラッシングなしで安定したビームが得られるという 特徴があり, 日常の実験をスムーズに行う事ができている.

電子放出面(直径約 200 nm)はタングステンの[100] 結 晶面であり極めて平坦な面から電子が放出される.周辺領域



図1 低エネルギー・ホログラフィー電子顕微鏡



図2 ショットキー電子源 (W/Zr Schottky FE). 電子放出面は 中央の直径約200 nm の平坦な円形の範囲. 赤矢印は実験中に 付着したと思われる不純物.

を含めた平均曲率 1 μ m による放射状の電界により電子は発 散を始めるが、タングステンを取り囲むサプレッサー電極の 負の電圧によって、再びアノード方向へ収束され数 mrad と いう小さい放出角度を実現している. この電子軌道を逆投影 した虚像カソードの直径 (Virtual source diameter) は約 15 nm である²⁾. アノードを通過した電子は、コンデンサー アパーチャにより一部を切り出しており、対物レンズで収束 させた後のスポットによる 2 次電子 SEM 像の分解能は 3 nm@5 kV となっている. またホログラフィーの分解能は 1 nm を切るところまで来ており,生物サンプル向けには満 足できるが,カーボンナノチューブなどの基礎物理の研究用 には将来 Cold-FEG の導入も必要であろう.

ショットキー型電子銃の 1800 K でのエネルギー分散は電 流が小さい時に理論上 0.3 eV という報告があり室温 300 K の Cold FE の理論値 0.27 eV と比較して若干大きいが大差は ないようである²⁾. エネルギー分散に伴う電子のコヒーレン ト長は次のように与えられる.

$$L = \lambda \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = 2\lambda \frac{V}{\Delta V} \tag{1}$$

ショットキー型電子銃のエネルギー分散 0.3 eV に対する コーレント長は、30 kV の電子ビーム(波長 0.07 Å)に対して、 1.4 μ m となる. これが後述する図4(a)の光路差 dより大 きくなくてはならない. ところで Gabor の In-line Holography も通常の光学顕微鏡と同様に、その空間分解能はレイリー (Rayleigh)の分解能から次式で与えられる.

$$\delta_x = 0.61 \times \frac{\lambda}{NA} = 0.61 \times \frac{\lambda}{\sin\theta} \tag{2}$$

ここで*NA* は対物レンズの開口数, θ は物体から散乱する 電子波の光軸に対する最大角度であり,分解能 1Å を得るに は,43 mrad の散乱角度が必要であり,その時の光路差は最 大 $0.1 \mu m$ となり,ショットキー型電子銃のコヒーレント長 が十分である事がわかる.

カラムを出た電子ビームは、5.5 mm 下流に直径数ナノメートル程度のスポットを形成する. ここがサンプル位置であり、 通常の TEM 向けサンプルホルダーを搭載できるステージが 準備されている. ステージは XYZ 方向に高精度で移動可能. また、ホルダーを 360 度回転可能なステージとなっている.

サンプルを通過した電子は下流に用意された光学系にて約 1.3 メートル下流の大型2次元電子検出器へと輸送され、2 次元のホログラムが撮像される.図3に電子ビーム光学系 を示す.

2次元電子検出器は、ドイツの TVIPS 社の製品である. 蛍光シンチレーターを用い、エネルギー約4 keV 以上の電子 が検出可能となっている.シンチレーター膜と CMOS 検出



図3 電子ビーム軌道. S:電子源, A1:アノードアパーチャ, M1:コンデンサレンズ, A2:コンデンサアパーチャ, M2: SEM 対物レンズ, E1:減速モードでの静電レンズ, M3, M4:プロジェクターシステム, A3:エネルギーフィルター及び S-TEM 電子検出器, E2:加速モードでの静電レンズ, D:蛍光 CMOS 検出器. Sから E1が Geminiカラム, 長さ約 30 cm, Sample から Dまで 1.3 m.



図4 (a) Gabor in-line holography: 点光源を参照波とするホログラム. (b) 平面波を参照波とするホログラム. (c) 点散乱 のホログラムはニュートンリングとなる.

器とは、光ファイバーバンドルにて結合されており、蛍光を 8k×8k ピクセルで撮像する.

ホログラムの撮影は、始めに S-TEM モードにてサンプル を大まかに観察し、ビーム電流を止めて、目標となる観察位 置にビーム照準を合わせ、サンプルを Z 軸方向(下流へ)数 100 µm 移動させて、必要な露光時間ビームを出して撮影す る.場合によっては繰り返し同じ場所を撮影して、サンプル のビームダメージを確認する.

3. In-line Holography の原理と実際

図 4a にホログラフィー顕微鏡の概念を示す. ビームを収 束し点光源を形成. 点光源から δ だけずれた位置にサンプル (point object)を置く. 散乱波と参照波とが干渉する. 軸から 角度 θ だけ開いた方向から観察すると,二つの波の位相差は,

$$\Delta \phi = -\frac{2\pi\delta}{\lambda} \cdot (1 - \cos\theta) \tag{3}$$

となる. 合成波の強度は,

$$I = |\psi|^{2} = \psi_{R}^{*}\psi_{R} + \psi_{R}^{*}\psi_{O} + \psi_{O}^{*}\psi_{R} + \psi_{O}^{*}\psi_{O}$$

= 1 + 2Acos \(\Delta\) \(\phi\) + A² (4)

となり干渉縞は図4(c)に示すようにニュートンリングと なる.ここでAは参照波を1とした場合の散乱波の強度振幅. 重要な事は(4)式の1行目右の干渉項に複素振幅がそのま ま残っており,波の伝搬を計算すれば散乱波の複素振幅を解 く事が出来る事である.複素であるから「位相」が含まれて いる.残念な事に干渉縞は複素共役の和であり,実像には必 ずその共役な虚像(Ghost)が含まれてしまう.これが図5(c) の金粒子の周囲の円環状のパターンである.

次に図4(b)に示すような平面波によるホログラフィーに つき位相差を計算すると、(1)式と全く同じ形の式が得られ る.ただし $L = \delta$ となっている.Gabor in-line holography で は δ は100 μ m 程度であるから、near field の散乱波を観察し ている事になる.つまり Fresnel 回折を観察していることに 等しい. 従って,像の再生は,Fresnel 回折を次の Kirchhoff-Sommerfeld 積分よって上流へ逆伝搬することによって一意 に決定される.

$$\Psi(x, y, z) = \frac{1}{i\lambda} \iint \Psi(x', y', 0) \frac{e^{-ikr}}{r} \cos\theta \, dx' dy' \tag{5}$$

これを数値積分によって直接解くことも可能ではあるが, 計算時間が膨大となるため実用的ではない. 幸いなことに, (5)式が畳み込み積分となるため, 高速 FFT を用いた次の ような手法が知られている³.

$$f_0(x,y) \xrightarrow{\text{FFT}} F_0(p,q) \to \boxed{\times \exp\left[\frac{1}{2}ikz\lambda^2(p^2+q^2)\right]} \xrightarrow{\text{FFT}^{-1}} f_z(x,y)$$
(6)

ここで第三項は伝搬による位相変化を表現している.

ところで、通常のX線回折実験は図4(b)に相当してい るが、細く平行なX線ビームをサンプルに照射し、その回 折像を下流で観察するため、入射ビーム(参照波)と散乱波 は重ならない.従ってホログラムとはならず、(4)式のA²の みが観察され位相情報が失われており、(5)式を積分しても 正しい複素振幅は得られない.これが回折現象における位相 問題である.X線自由電子レーザーの応用分野においてA²の 空間分布から反復法により位相を回復する試みが行われて来 たが、解の不安定性を完全には解決できていないようである.

4. 顕微鏡像の例

図5に、開発初期に撮影した例を示す. グラフェンの上 に乗せた金粒子(20~50 nm)をSEM 観察したものである. 当時(2015年)、我々の実験室は3階にあり、すぐ隣で大学 の建屋建設工事が行われており、地響きがするぐらいの振動 の中で撮影した. ご覧の通り、SEM 像が大きく揺らいでい る(振幅~20 nm). 図5(b) はホログラムであり、ニュー トンリングが観察される. 図5(c)が実像に戻したもので ある. 中央に見える金粒子の詳細な形状は、静穏な状態にあ



図 5 (a) グラフェン上の金粒子, SEM 像 (b) ホログラム (20 kV, δ 100 μ m), (c) 回復されたサンプル像. 上部の大きな 2 個の物体は, 破損した SiN グリッドの影であり, グラフェンの転写とクリーニング中に破損したと推測される.



図6 (a) lacey carbon の SEM 像, (b) ホログラフィー, (c) 回復像 (反復ゴースト処理なし)

る別の SEM 観察した像と一致した.分解能は 3 nm 程度で あった.ご覧のように、回復された実像には振動が消えてい る事がわかる.これは回折波による顕微鏡法が振動の影響を 低減できる事を示している.なお金粒子の周辺の黒い汚れの ような部分とリング状のさざ波が Ghost である.単粒子解析 の場合,粒子が孤立していれば、反復法により Ghost を消す 手法が各種報告されている⁴.

2015年末になり新建屋が完成し、振動の少ない1階に電 子顕微鏡を移設し、ソフトマテリアルや氷包埋した生体サン プルなどの観察を行なって来た.図6が市販されている TEM グリッド (lacev carbon) の撮像例である. 図6 (a) の 赤丸部分に参照光の中心を合わせて、サンプル位置を下流へ 200 µm ずらして, 20 kV にて 2 秒間撮影したものが図 6 (b) のホログラフィーである. これを(6) 式に従って物体像に 戻したものが図6(c) である. lacey carbon の細部がよく観 察できているのがわかる. 分解能は約1nm 程度であるが, これは Gemini Column が作り出す焦点での交差角度によっ て制限されており,現在のオプティクスでは3.5 mrad であり, (2) 式による分解能は 1.5 nm でありほぼ観測値と合致して いる.実像の周辺に残っている干渉縞がゴーストであり、反 復法で消去できる事がわかっているため、今後実装する予定 である. なおホログラフィー像が回転しているのは、サンプ ルから下流のプロジェクターシステムに使われている2個の 磁場レンズによるビーム軸の回転によるものである.

現在, 氷包埋した生体サンプルの撮像条件の最適化を行 なっている. 当初, 氷包埋装置(FEI Vitrobot)を用いて通 常のパラメータにて実験を行なっていたが、氷の厚さが 100 nm 程度の場合、30 kV の電子が通過できないため、氷 を薄く(<50 nm)作る条件だしを行なっている. これは当 初予想したようには単純ではなく現在、基盤の選定、氷包埋 パラメータの調整、界面活性剤による表面張力の調整などを 行なっている.

なお氷包埋したタバコモザイクウイルス(TMV)などを試 験的に観察しているが、まだ氷が厚いために、長い照射時間 を要しており、結果的に電子照射量が高くなり(~100 e/A²)、 サンプルのダメージが発生しており紙面に発表できるイメー ジはまだ得られていない. 今後、調整が進めばウイルス等の イメージが高いコントラストで1回の撮像で得られる事を期 待している.

この開発を通した経験が,将来的には標準的なTEMをベースにした高分解能の In-line Holography への発展も視野に入ってくるだろう.また数100 V という低いエネルギーによるイメージングも基礎物理研究に貢献できるだろう.

文 献

- Gabor, D.: "A New Microscopic Principle", *Nature*, 161, 777–778 (1948)
- Toggle, D.W., Li, J.Z. and Swanson, L.W.: J. Microscopy, 140, 293– 301 (1985)
- E.G. Steward, Fourier Optics: An Introduction (Second Edition), Dover Books on Physics, ISBN 0-486-43504-0 (2011)
- Tatiana Latychevskaia and Hans-Werner Fink, "Solution to the Twin Image Problem in Holography", *Phys. Rev. Lett.*, 98, 233901 (2007)